

1. Record Nr.	UNISA996279994703316
Titolo	DFT : proceedings of the 2014 IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI and Nanotechnology Systems : 1-3 October 2014, Amsterdam
Pubbl/distr/stampa	New York : , : IEEE, , 2014
ISBN	1-4799-6155-8
Descrizione fisica	1 online resource (xvi, 190 pages)
Soggetti	Integrated circuits - Very large scale integration Nanotechnology Integrated circuits - Fault tolerance
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia